

前 言

本标准等同采用国际标准 IEC 384-10:1989《电子设备用固定电容器 第 10 部分:分规范:多层片式瓷介电容器》及其第 1 号修订单(1993)。该标准所包括的多层片式瓷介电容器,我国已生产了数年,引进了数条生产线,在技术指标、试验严酷度和质量保证等方面已达到国际标准水平。制定本标准为促进该类产品的国际贸易与技术交流,参加国际质量认证,打下了良好的基础。

本标准代替 GB 9324—88,因为 GB 9324—88 是等同采用 IEC 384-10 的中办文件,国际电工委员会于 1989 年发布了正式版本即 IEC 384-10(QC 301900),两者在条款的编排和技术内容上有一定的差别,本次对 GB 9324—88 进行修订,使其与 IEC 384-10 的正式版本协调一致。

标准中规定的试验方法和严酷度等级是从 GB 2693—90《电子设备用固定电容器 第 1 部分:总规范》(idt IEC 384-1:1982, Amendment 2(1987), Amendment 3(1989))中选取的。

本标准由中华人民共和国电子工业部提出。

本标准由电子工业部标准化研究所归口。

本标准由电子工业部标准化研究所起草。

本标准主要起草人:霍光。

本标准 1988 年 6 月首次发布。

IEC 前 言

1) IEC(国际电工委员会)在技术问题上的正式决议或协议,是由对这些问题特别关切的国家委员会参加的技术委员会制定的,对所涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见。

2) 这些决议或协议,以推荐标准的形式供国际上使用,并在此意义上为各国家委员会所认可。

3) 为了促进国际上的统一,IEC 希望各国家委员会在本国条件许可的情况下,采用 IEC 标准的文本作为其国家标准。IEC 标准与相应国家标准之间的差异,应尽可能在国家标准中指明。

序 言

本标准是由国际电工委员会第 40 技术委员会(电子设备用电容器和电阻器)制定的。

本标准文本以下列文件为依据:

六个月法	表决报告
40(C. O.)629	40(C. O.)665
40(C. O.)598	40(C. O.)646
40(C. O.)599	40(C. O.)647

从上表列出的表决报告中可以查阅到更详细的资料。

本标准封面的 QC 号是 IEC 电子元器件质量评定体系(IECQ)的规范号。

本标准替代了 IEC 384-10(1979):电子设备用固定电容器 第 10 部分:分规范:多层片式瓷介电容器 试验方法的选择和一般要求。

中华人民共和国国家标准

电子设备用固定电容器

第10部分:分规范

多层片式瓷介电容器

GB/T 9324—1996
idt IEC 384-10:1989
QC 301900
代替 GB 9324—88

Fixed capacitors for use in electronic equipment

Part 10:Sectional specification

Fixed multilayer ceramic chip capacitors

第1章 总 则

1 总则

1.1 范围

本标准适用于电子设备用额定电压一般不超过 200 V 的 1 类和 2 类非密封多层片式瓷介电容器。在必要时,可以在详细规范中规定较高电压。这些电容器具有金属化焊接区或带状引出端,以便直接安装在混合电路的基片或印制板上。

1.2 目的

本标准的目的是对这类电容器规定优先额定值和特性,并从 GB 2693 中选择适用的质量评定程序、试验和测量方法,以及给出一般特性要求。在详细规范中规定的试验严酷度和要求,应具有与本标准相同或较高的性能水平。因为,降低的性能水平是不允许的。

1.3 有关文件

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 2471—1995 电阻器和电容器优先数系(idt IEC 63:1963)

GB/T 2691—94 电阻器和电容器标志代码(idt IEC 62:1974)

GB 2693—90 电子设备用固定电容器 第1部分:总规范(idt IEC 384-1:1982)

GB/T 9325—1996 电子设备用固定电容器 第10部分:空白详细规范 多层片式瓷介电容器
评定水平 E(idt IEC 384-10-1:1989)

IEC 68 基本环境试验规程

IEC 410:1973 计数检查抽样方案和程序

IECQ/QC 001001:1986 IEC 电子元器件质量评定体系(IECQ)基本章程

IECQ/QC 001002:1986 IEC 电子元器件质量评定体系(IECQ)程序规则

ISO 3:1973 优先数和优先数系

注:上述文件除 IEC 68 必须采用在总规范相应试验条款中所指定的版本外,其余均采用现行版本。

1.4 详细规范中应给出的内容

详细规范应按有关的空白详细规范来制定。

详细规范不应规定低于总规范、分规范或空白详细规范所规定的要求。当包括更严格的要求时,应

国家技术监督局 1996-07-09 批准

1996-12-01 实施